# 太陽電池用亜酸化銅(Cu2O)薄膜とインジウムスズ酸化物の性能改善

Improved performance of copper suboxide (Cu2O) thin films and indium tin oxide for solar

cells

日本大学 生産工学研究科 XU JIAWEI , 清水耕作

## 1 まえがき

現在主流の太陽電池は結晶シリコン太陽電池 である。シリコンのバンドギャップより太陽光ス ペクトルの内 400nm 以下の近紫外光は表面の吸収 係数が大きいため、余剰フォトンエネルギ効果に より、余分なエネルギを熱として放出し、変換効 率が下がることが課題である。

### 2 目的

変換効率の低下を改善するために、従来よりも 広範囲の波長の光を吸収し、空乏層を広げること ができる材料である約 2.1 eV のバンドギャップ を持つp型半導体である亜酸化銅(以降 Cu<sub>2</sub>0)、及 びシート抵抗を下げ、透過率を高めることができ る透明電極の作製条件の検討を行う。

### 3 実験方法及び評価方法

3.1 Cu<sub>2</sub>0 作製作製プロセス

抵抗加熱蒸着法によって 3.6\*10<sup>-6</sup> Torr の真空 度の上に Cu を蒸着、各酸化処理した後、XRD を行 う、薄膜内部の成分変化を評価する。Fig.1に素子 構造変化を示す、Fig.2に素子作製の流れを示す。



glass substrate cleaning
Cu deposition
Oxygen plasma treatment
Annealing in air
Physical

Fig.2 Process flow of device fabrication (with Oxygen plasma treatment )

アニール温度の影響を確認するため、温度だけ 調整してアニールを行った。

アニール条件は窒素流量 0sccm で加熱時間を 2 hour とし、管状炉を用いてアニール温度を 100~ 300 ℃に調整し、大気アニールを行った。

アニール後、Cu<sub>2</sub>Oの結晶構造を評価するために X線回折(XRD)を用いて、各温度での結晶性の変 化を調べた。XRDの測定結果から、アニール温度が Cu<sub>2</sub>Oの結晶相に与える影響を解析した。

#### 3.3 ITO 温度依存性の評価

スパッタリング法を用いて、真空度 1.0 Pa の条 件で ITO 膜を成膜した後、温度を 100~200℃に制 御してアニールを行った。

アニール後、ITO 膜の温度依存性を評価するため、四端子薄膜抵抗計を用いてシート抵抗を測定して評価を行った。

### 3.4 Cr/N-Si/Cu<sub>2</sub>0/IT0 太陽電池の試作及び評価

Cr/N-Si/Cu<sub>2</sub>0/ITO 構造の太陽電池を試作し、その性能を評価した。まず、基板として N 型シリコンを使用し、その上に亜酸化銅(Cu<sub>2</sub>0)を作製させた。その後、Cr をバックコンタクトとして形成し、 最上部に透明電極として ITO を成膜した。

作製した太陽電池の評価では、IV 特性を測定して評価を行う。

Fig.3に試作太陽電池の断面構造を示す。



Fig.3 Device structure

<sup>4</sup> 結果および考察

# 4.1 Cu<sub>2</sub>0 温度依存性の評価結果







Fig.4は、温度変化による XRD 測定結果を示し ており、100~300℃の範囲で熱酸化処理を行った 試料の結晶構造の変化が観察できる。高温になる につれ、Cu20のピークが減少し、300℃では Cu0 の生成が確認される。

また、Fig.5は、各温度でアニールを行った試料の表面写真を示している。150℃までの試料はCu20が優勢で、色が安定しているが、200℃を超えると表面が変色し、透明感が減少していることがわかる。これは、Cu20の分解に伴いCu0が生成され、バンドギャップが変化していることが原因と考えられる。

以上の結果から、Cu<sub>2</sub>0の最適な生成温度はお よそ 120℃であることが示唆される。この温度で は Cu<sub>2</sub>0 の結晶性が安定し、他の相(Cu、Cu0)の 生成が抑えられている。



4.2 ITO 温度依存性の評価結果

Fig.6 Temperature dependence of ITO sheet resistance

Fig.9は、アニール温度に対する ITO 膜のシート 抵抗の変化を示す。温度が 100~160℃の範囲で は、シート抵抗は比較的安定しており、アニール 前のシート抵抗より低くなる。しかし、180℃を 超えるとシート抵抗が急激に増加し、200℃では 100Ω/□を超える値が出た。

以上より、ITO 膜の電気特性は 160℃以下で最 も安定しており、180℃以上の高温では結晶構造 の変化や大気不純物の影響により、シート抵抗が 大幅に増加することが示唆される。したがって、 ITO 膜のアニールにおいて、最適な温度範囲は 160℃までであると考えられる。

4.3 太陽電池の試作の評価



Fig.7 I-V characteristics of Cr/N-Si/Cu2O/ITO solar cell

Fig.7は、試作した太陽電池の発電特性を示している。電圧が増加するにつれて、電流が減少する典型的なダイオード特性が確認できる。また、電流値が非常に低いことから、試作したデバイスの変換効率が十分に高くないことが分かる。



Fig.8 Energy band diagram of Cu<sub>2</sub>O/N-Si junction

Fig.8は、Cu<sub>2</sub>0とN型シリコン(N-Si)のバンド 構造を示している。Cu<sub>2</sub>0のバンドギャップは約 1.8 eVであり、N-Siとの界面で電位差(V<sub>bi</sub>=1.06 eV)が形成されることが確認される。これによ り、キャリア分離が可能となり、太陽電池として の動作の可能性を確認できる。

# 5 **まとめ**

本研究では、Cu<sub>2</sub>0 および ITO 膜の温度依存性を 評価し、太陽電池の試作とその特性を検討した。 Cu<sub>2</sub>0 のアニールに関しては、120℃が最適な温度で あり、この温度で Cu<sub>2</sub>0 の結晶構造が安定して生成 されることが確認された。一方、ITO 膜の評価では、 160℃までの範囲でシート抵抗が安定しており、 180℃以上では電気特性が劣化することが明らか になった。

さらに、Cu<sub>2</sub>0/N-Si 接合を用いた太陽電池の試作 では、I-V 特性から電流密度が低く、デバイス効率 の向上が課題であることが示された。バンド構造 の解析結果から、Cu<sub>2</sub>0の表面準位や界面状態が電 池性能に大きく影響していると考える。

今後の課題として、Cu<sub>2</sub>0の結晶品質や界面状態 の改善、ITO 膜の透過率と電気特性の最適化が必 要である。これらの改善により、太陽電池の変換 効率向上が期待される。

# 参考文献

(1)Li Hai-Tao Jiang Ya-Xiao Tu Li-Min Li Shao-Hua Pan Ling Li Wen-Biao Yang Shi-E Chen Yong-Sheng "Influence of annealing temperature on properties of Cu2O thin films deposited by electron beam evaporation" Acta Phys. Sin. vol.No.5 pp. 053301 (2018)